

えつくすせんしょうかくさんらんほう

X線小角散乱法

■ 用語解説 ■

X線を照射し、散乱した X線を測定することで物質の構造情報を得る手法である。広角散乱分析法（X線回折）は結晶中の原子配列のオンGSTROOM (1×10^{-10} メートル)オーダーの分析に使用されるのに対し、小角散乱法は微粒子や液晶、合金の内部構造の数ナノメートル (1×10^{-9})レベルの構造の分析に使用する。→小角散乱法